

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-003657

(43)Date of publication of application: 14.01.1994

(51)Int.CI.

G02F 1/1333

G02F 1/13

(21)Application number: 04-164762

(71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing:

23.06.1992 (72)In

(72)Inventor: IWAMOTO MAKOTO

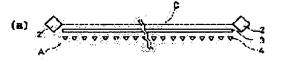
FUKUCHI TOSHIO MISONO KENJI ISOHATA KYOHEI NAGANO YASUYUKI NISHIDA KENJI

(54) MARK FOR POSITIONING

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable the mark retrieval of an alignment mark in a short time facilitate positioning and enable highly accurate positioning as a result.

CONSTITUTION: A terminal lead alignment mark A and a cell separation alignment mark B are formed in a sample comprising two substrates pasted to each other. Both alignment marks A and B have, in addition to conventional diamond marks 2 and 2, or cross marks 6 and 6, a solid line mark 3 and a dashed line mark 7 continuous between the marks 2 and 2, or 6 and 6. In aligning a separation position, two arbitrary points of the solid line marks 3 and bashed line marks 7 are used.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]



[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-3657

(43)公開日 平成6年(1994)1月14日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 2 F 1/1333

5 0 0 1 0 1 9225-2K

1/13

9315-2K

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平4-164762

(22)出願日

平成 4年(1992) 6月23日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 岩本 誠

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 福地 俊生

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 御園 健司

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74)代理人 弁理士 原 謙三

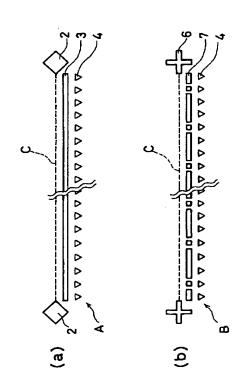
最終頁に続く

(54) 【発明の名称 】 位置決め用マーク

(57)【要約】

【構成】 2枚の基板が貼り合わされたサンプルには、端子出し用アライメントマークAと、セル分断用アライメントマークBとが形成されている。これら両アライメントマークA・Bは、それぞれ、従来通りの菱形マーク2・2、又は十字マーク6・6に加え、これら菱形マーク2・2、又は十字マーク6・6を繋ぐ実線状マーク3、一点鎖線状マーク7が形成されている。分断時の位置決めは、これら実線状マーク3、一点鎖線状マーク7の任意の2点を用いて行う。

【効果】 アライメントマークのマーク検索が短時間で行え、位置決めが容易になり、ひいては、髙精度の位置 決めを可能とする。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】基板の位置決めに用いられ、所定の部位が 拡大して表わされる位置決め用視野にて認識され、基板 上の所定の点を示す点状のマークと、基板におけるX軸 方向及びY軸方向の少なくとも何れか一方を示す線状の マークとを組み合わせたマークからなることを特徴とす る位置決め用マーク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば液晶表示素子を作製する際、配向膜印刷工程、基板の貼り合わせ工程、セル分断工程等の各工程毎に必要である基板の位置決めに用いられる位置決め用マークに関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に、液晶表示素子は、互いに対向した例えばガラス等からなる二つの基板の間に液晶材料が介装された構成を有している。

【0003】このような液晶表示素子の作製には、まず、液晶表示素子の基板となる2枚のガラス基板を用意する。そして、これらガラス基板の上にITO膜を蒸着後、電極パターンをフォトパターニングすることによりITO電極を形成し、配向膜印刷、配向処理を施し、セルギャップ材を散布すると共にシール印刷を行って、2枚の基板をそれぞれの膜形成面が対向するように貼り合わせる(基板の貼り合わせ工程)。その後、貼り合わされた一対の基板を、所定の形状に分断し(セル分断工程)、液晶材料を注入する。

【0004】ところで、上記のように液晶表示素子を作 製する各工程においては、基板を各々の装置のステージ 上にセットするようになっている。そこで、問題となる 30 のが、ステージ上にセットされた基板の位置決めであ る。この位置決めが不充分なものであると、即、液晶表 示素子の性能に影響を与え、製造時のロス増加に繋が り、製造コスト上昇ということとなる。したがって、従 来では、基板上にフォトパターニングしてITO電極を 形成する際、各工程別に位置決め用マークとしてのアラ イメントマークを同時に形成し、このアライメントマー クが、顕微鏡等を用いた位置決め用視野であるアライメ ント視野の所定部位に位置するようにステージの位置を 調整することにより、基板の位置決めを行っている。以 40 下、このように、アライメント視野の所定部位にアライ メントマークを捉えることを、アライメント視野にてア ライメントマークを認識すると言う。

【 0 0 0 5 】例えば、セル分断工程においては、一対の 基板をダイシング装置のステージ上にセットし(プリア ライメント)、セル分断ラインを示すべく予めセル分断 ラインの両端部方向に形成されている点状のアライメン トマークの一方をアライメント視野にて認識し、次い で、もう一方のアライメントマークも認識されるようス テージを移動させて(平行出し)、基板の位置決めを行 50 っている。

【0006】また、オフセット印刷を用いた配向膜印刷 工程においては、基板をオフセット印刷装置のステージ 上にセットし、基板に予め形成されている複数の点状の アライメントマークが、アライメント視野内にて各々認 識されるように、ステージを移動させて基板の位置決め を行っている。

【0007】そして、近年においては、液晶表示素子の大型化、高精細化が進み、より一層の高い位置決め精度が要求されており、これに応えるため、アライメント視野の倍率を上げ、高倍率のアライメント視野での位置決めを行うようになってきている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従来の構成においては、基板の位置決めに用いられるアライメントマークが、所定のポイントを示す点状のマークのみからなるため、近年の要求に応え、高倍率のアライメント視野にて位置決めを行った場合、プリアライメント時の僅かなずれでもアライメントマークがアライメント視野内から外れ、エラーとなり再びプリアライメントを行うか、多大な時間を掛けてマーク検索を行っており、作業性の向上が図れない等の問題を生じている。

【0009】これは、アライメント視野の倍率を上げ、 高倍率視野で基板の位置決めを行う場合、高倍率視野で アライメントマークを認識するため、必然的にアライメ ントマーク自身が小さくなり、アライメント視野内から 外れ易くなるためである。

【0010】さらに、作業性の低下を考えると、アライメント視野の倍率を思うように上げることができず、充分に高い精度で基板の位置決めを行うことができないという問題も生じている。

【0011】そこで、本発明は、上記課題に鑑みなされたもので、プリアライメント時の僅かなずれにても、アライメント視野内から外れ難いと共に、例えアライメント視野内から外れた場合でも短時間でのマーク検索が可能であるアライメントマークを提供することにより、ひいては、高倍率視野による高精度の位置決めを可能とすることを目的としている。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の位置決め用マークは、上記課題を解決するために、基板の位置決めに用いられ、所定の部位が拡大して表わされる位置決め用視野にて認識され、基板上の所定の点を示す点状のマークと、基板におけるX軸方向及びY軸方向の少なくとも何れか一方を示す線状のマークとを組み合わせたマークからなることを特徴としている。

[0013]

【作用】上記の構成によれば、位置決め用マークが、基板上の所定の点を示す点状のマーク(以下、点状マークと略記する)と、基板におけるX軸方向及びY軸方向の

少なくとも何れか一方を示す線状のマーク(以下、線状 マークと略記する)とを組み合わせたマークからなる。 したがって、従来の構成においては、点状マークのみの 位置決め用マークであったため、点状マークがX軸方 向、Y軸方向の何れの方向にずれても位置決め用視野内 から外れてしまうが、本発明の位置決め用マークにおい ては、例え点状マークがずれても、そのずれ方向が線状 マークの延びる方向であれば線状マークが位置決め用視 野内に入るようになっている。また、例え、線状マーク までもが位置決め用視野内から外れたとしても、線状マ ークが形成されている方向、即ち、一軸方向の検索で、 線状マークを視野内に捉えることができるようになって いる。線状マークを視野内に捉えることができれば、線 状マークに沿って基板を移動させることにより、容易に 点状マークを認識することができる。この結果、従来の 位置決め用マークを用いた場合に比べて、マーク検索に 要する時間を短縮することができ、位置決めが容易にな る。

【0014】さらに、基板の方向を合わせるだけでよい例えばセル分断工程等における位置決めは、線状マークのみを用いて行えるので、従来の位置決め用マークを用いた場合に比べて、より一層マーク検索に要する時間を短縮することができ、位置決めが容易になる。

【0015】このように、位置決めが容易になるので、 作業性に影響を及ぼすことなく、位置決め用視野の倍率 を高倍率に上げることができ、高精度の位置決めが可能 となる。

[0016]

【実施例】

[実施例1] 本発明の一実施例について図1ないし図5に基づいて説明すれば、以下の通りである。尚、本実施例は、本発明に係る位置決め用マークを、液晶表示素子作製時の端子出し分断工程及びセル分断工程に用いた場合を例示している。

【0017】まず、液晶表示素子の基板となる例えばガーラスからなる基板上に、ITO膜を蒸着し、このITO膜の上にフォト・レジストを塗布する。そして、このフォト・レジストが塗布されている基板表面に、電極パターンと共に、配向膜印刷工程、基板の貼り合わせ工程、端子出し工程、セル分断工程等に必要である各工程別の40アライメントマーク(位置決め用マーク)のパターンを露光した後現像して余分な部分を取り除く。次いで、ITO膜のフォト・レジストで覆われていない部分を薬品で溶かし、最後に残りのフォト・レジストを除去し、基板上に、ITO電極と、各工程別のアライメントマークとを形成する。

【0018】このようにして形成した2つの基板1a・ 1bの平面図、正面図、側面図を図2・図3に示す。 尚、図面上においては、わかり易くするために、端子出 し工程及びセル分断工程に用いるアライメントマークの 50 み図示している。平面図においては、端子出し用アライメントマークAが形成されている部分を一点鎖線で示す一方、セル分断用アライメントマークBが形成されている部分を二点鎖線で示し、さらに、正規の分断ラインCを破線にて示している。正面図、側面図においては、端子出し用アライメントマークA及びセル分断用アライメントマークBが形成されている部分を矢印で示している。また、基板1a・1bを貼り合わせた場合を想定して、図2の(a)に示す基板1aは、ITO電極が形成されている面、つまり、アライメントマークA・Bが形成されている面を紙面奥側にして図示し、図3の(a)に示す基板1bはアライメントマークA・Bが形成されている面を手前側にして図示している。

【0019】上記基板1a・1bに形成されている一点 鎖線で示す端子出し用アライメントマークAは、その拡 大図である図1の(a)に示すように、点状マークであ る菱形マーク2・2と、切り捨て方向を示す三角マーク 4と、菱形マーク2・2の間を繋ぐ正規の分断ラインC から所定の距離を有して形成された線状マークである 線状マーク3とから構成されている。一方、二点鎖線で 示すセル分断用アライメントマークBは、図1の(b) に示すように、点状マークである十字マーク6・6と、 上記と同様の三角マーク4と、十字マーク6・6の間を 繋ぐ正規の分断ラインCから所定の距離を有して形成された線状マークである一点鎖線状マーク7とから構成されている。尚、上記三角マーク4、実線状マーク3、一 点鎖線状マーク7は、分断後、切り捨てられる領域に形 成されている。

【0020】上記2つの基板1a・1bを、所定の基板の貼り合わせ工程を施して、図4に示すように貼り合わせる(以下、この貼り合わせた一対の基板をサンプル5と称する)。尚、図においては、説明を容易にするために、基板1aと基板1bとが密着して表されているが、実際には、図示しないセルギャップ材を介して貼り合わされており、所定の間隙を有している。

【0021】次いで、上記サンプル5を、基板1a側を 上方に向けて、図示しないダイシング装置((株) 岡本 工作機械製作所製)のステージにセットする。

【0022】そして、まず、上記サンプル5に対して端子出し処理を行う。高倍率を有する位置決め用視野であるアライメント視野にて基板1 aに形成された端子出し用アライメントマークAを捉え、アライメント視野内に入っている実線状マーク3の任意の2点が、アライメント視野内の所定部位に位置するように、ステージを移動させて(平行出し)、ステージの位置を調整することにより、サンプル5の位置決めを行う。以下、このように、アライメント視野の所定部位にマークを捉えることを、アライメント視野にて認識すると言う。尚、アライメント視野内に、アライメントマークAが入っていない場合においては、実線状マーク3が形成されている方向

5

にステージを移動させることにより、アライメント視野 内に実線状マーク3を捉え、その後、上記と同様に実線 状マーク3の任意の2点を用いて、平行出しを行い、位 置決めを行う。

【0023】このようにして、位置決めを行った後、実線状マーク3と所定の間隔離れた正規の分断ラインCにて基板1aの分断を行い、基板1bの端子出し部分を形成する。尚、このような分断処理が施される分断ラインは、実際に分断が必要な距離に対し、充分な余裕をもった長さに設定されている。

【0024】次いで、基板1aの端子出し処理が終了したならば、サンプル5の表裏を反転した後90°回転し、上記と同様に、端子出し用アライメントマークAにてサンプル5の位置決めを行った後、基板1bの端子出し処理を行い、基板1aの端子出し部分を形成する。

【0025】続いて、上記のように端子出し処理が施されたサンプル5に対してセル分断処理を行う。アライメント視野にて基板1aに形成された分断用アライメントマークBを捉え、上記と同様に、アライメント視野内に入っている一点鎖線状マーク7の任意の2点を認識して(アライメント視野内に一点鎖線状マーク7が入っていない場合は、上記と同様に検索する)、平行出し及び位置決めを行った後、正規の分断ラインCにて分断を行う。但し、セル分断処理の場合、両基板1a・1bとも一度に分断する。その後、サンプル5を90°回転し、上記と同様に、セル分断用アライメントマークBにて位置決めを行った後分断する。

【0026】このようにして、端子出し処理、及びセル 分断処理が施されたサンプル5は、図5に示すように、 個々のセル5'となる。その後、所定の処理が施され、 液晶部材が注入される。

【0027】以上のように、本実施例のサンプル5を構 成する各基板1a・1bに設けられた端子出し用アライ メントマークA、及びセル分断用アライメントマークB は、それぞれ、菱形マーク2・2、十字マーク6・6に 加えて、正規の分断ラインCから所定の距離を有して形 成された実線状マーク3、一点鎖線状マーク7が形成さ れた構成となっているので、従来のように、菱形マーク 2・2や、十字マーク6・6を用いずとも、菱形マーク 2・2、十字マーク6・6に比べてアライメント視野内 に入り易い実線状マーク3や、一点鎖線状マーク7上の 任意の二点を用いて、サンプル5の平行出しが行え、位 置決めができる。また、稀に、全くアライメント視野内 に、アライメントマークA・Bが認識されない場合にお いても、従来のように、X・Y軸両方向に検索しなくて も、実線状マーク3、一点鎖線状マーク7が形成されて いる一方向の検索のみで容易にアライメント視野内に実 線状マーク3、または一点鎖線状マーク7を捉えること ができる。したがって、高倍率のアライメント視野を用 いた構成でも、アライメントマークの検索に多大な時間 を要することがなく、位置決めを容易に行える。

【0028】 [実施例2] 本発明の他の実施例について 図6及び図7に基づいて説明すれば、以下の通りであ る。尚、本実施例は、本発明に係る位置決め用マーク を、液晶表示素子作製時の配向膜印刷工程に用いた場合 を例示している。また、上述の実施例の同一の機能を有 する部材については、同一の記号を付記する。

【0029】本実施例の説明図である図6には、上記実施例に用いた基板1aに形成されている配向膜印刷工程に用いられる配向膜印刷用アライメントマークDと、セルのパターン位置を表している。

【0030】上記基板1aに形成されている配向膜印刷用アライメントマークDは、その拡大図である図7に示すように、菱形マーク2・2と、これら菱形マーク2・2の両側に形成された実線状マーク3とから構成されている。

【0031】上記基板1aに対して、配向膜印刷処理を 行う場合、まず、上記基板1aを、図示しない配向膜印 刷用の版を備えたオフセット印刷装置のステージにセッ トする。この場合、高倍率のアライメント視野は、予 め、版に合わせた正規の位置に設定されている。基板1 a をセットした後、アライメント視野内の所定のポイン トに上記菱形マーク2・2が位置するように、ステージ を移動させて基板1aの位置決めを行う。従来では、菱 形マーク2・2のみしか形成されていなかったため、菱 形マーク2・2がアライメント視野内から外れていた場 合、X・Y両軸方向に検索を行い、この検索のために多 大な時間を要したが、本実施例のアライメントマークD は、図7に示すように、菱形マーク2・2の両端に、実 線状マーク3が形成されているため、この実線状マーク 3にて菱形マーク2・2の形成されている方向がわかる ので、これに基づいてステージを移動させ、菱形マーク 2・2を認識し、位置決めを行う。その後、所定の配向 膜印刷処理を施し、基板1 a に配向膜を印刷する。

【0032】以上のように、本実施例のアライメントマークDも、上記実施例と同様に、配向膜印刷用アライメントマークDが、点状の菱形マーク2・2と、これら菱形マーク2・2の両側に形成された実線状マーク3とから構成されているので、実線状マーク3にて検索方向が判断でき、菱形マーク2・2を容易に認識できる。したがって、前実施例と同様に、高倍率のアライメント視野を用いても、容易に位置決めを行うことができる。

[0033]

【発明の効果】本発明の位置決め用マークは、上記課題を解決するために、基板の位置決めに用いられ、所定の部位が拡大して表わされる位置決め用視野にて認識され、基板上の所定の点を示す点状のマークと、基板におけるX軸方向及びY軸方向の少なくとも何れか一方を示す線状のマークとを組み合わせたマークからなる構成である。

6

7

【0034】それゆえ、従来の位置決め用マークを用いた場合に比べて、マーク検索に要する時間を短縮することができ、位置決めが容易になり、ひいては、アライメント視野の倍率を高倍率に上げることができ、高精度の位置決めを行うことができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例におけるアライメントマークの形状を示すものであり、(a)は端子出し用アライメントマークの説明図で、(b)はセル分断用アライメントマークの説明図である。

【図2】(a)は上記両アライメントマークが形成された基板の平面図で、(b)はその正面図で、(c)はその側面図である。

【図3】(a)は上記両アライメントマークが形成されたもう一方の基板の平面図で、(b)はその正面図で、(c)はその側面図である。

【図4】(a)は図2の基板と図3の基板が貼り合わされて形成されたサンプルの平面図で、(b)はその正面図で、(c)はその側面図である。

【図5】図4のサンプルから分断されて形成されたセル 20 の平面図である。

【図6】本発明の他の実施例における、セルパターン及

び配向膜印刷用アライメントマークが形成された基板の 平面図である。

【図7】上記配向膜印刷用アライメントマークの形状を 示す説明図である。

【符号の説明】

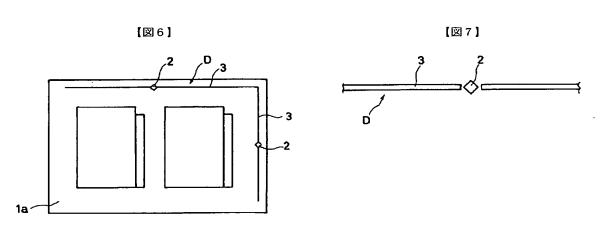
1 a 基板

1 b 基板

- 2 菱形マーク(点状のマーク)
- 3 実線状マーク (線状のマーク)
- 10 4 三角マーク
 - 5 サンプル
 - 5' セル
 - 6 十字マーク(点状のマーク)
 - 7 一点鎖線状マーク (線状のマーク)
 - A 端子出し用アライメントマーク(位置決め用マー

ク)

- B セル分断用アライメントマーク (位置決め用マー
- ク)C 正規の分断ライン
- D 配向膜印刷用アライメントマーク(位置決め用マーク)

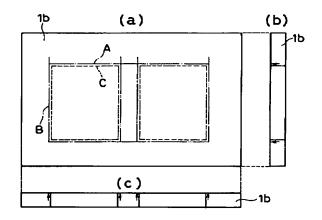


(a) (b)_{1a}

【図2】

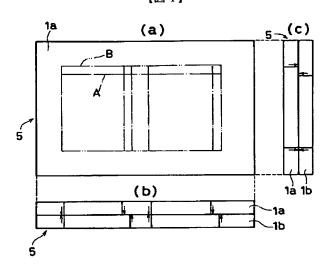
1a

【図3】



【図4】

(c)



フロントページの続き

(72)発明者 磯畑 恭平

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

(72) 発明者 長野 泰之

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72)発明者 西田 賢治

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内